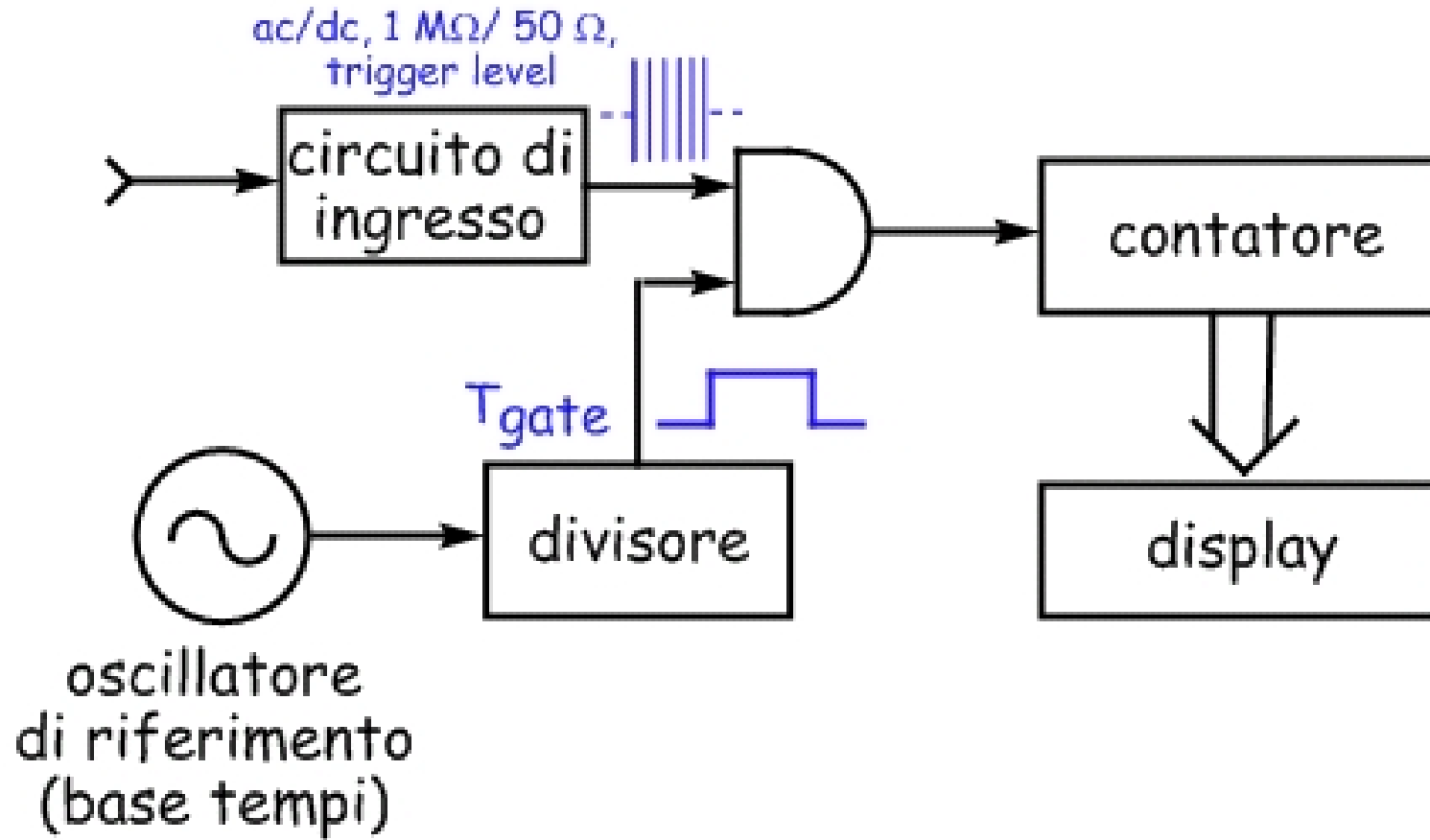


Strumenti

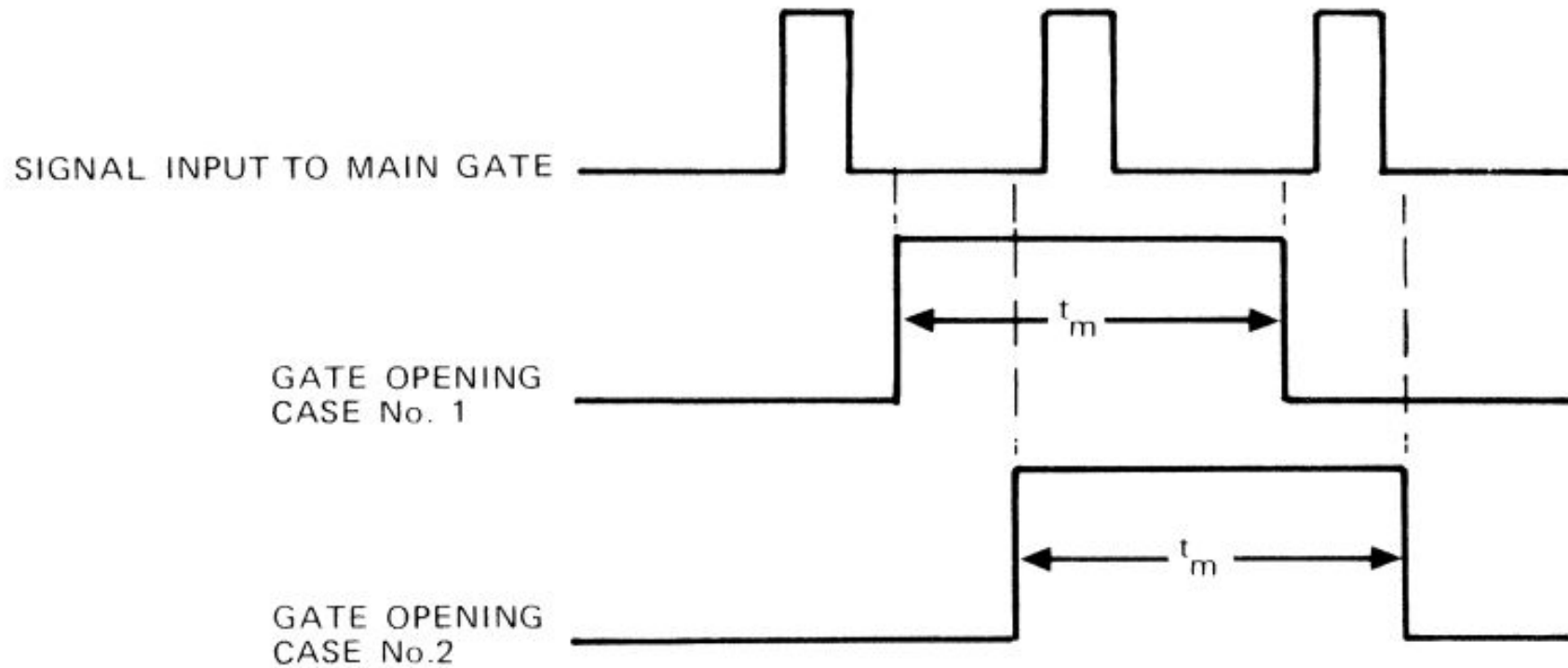
contatore elettronico, voltmetro integratore

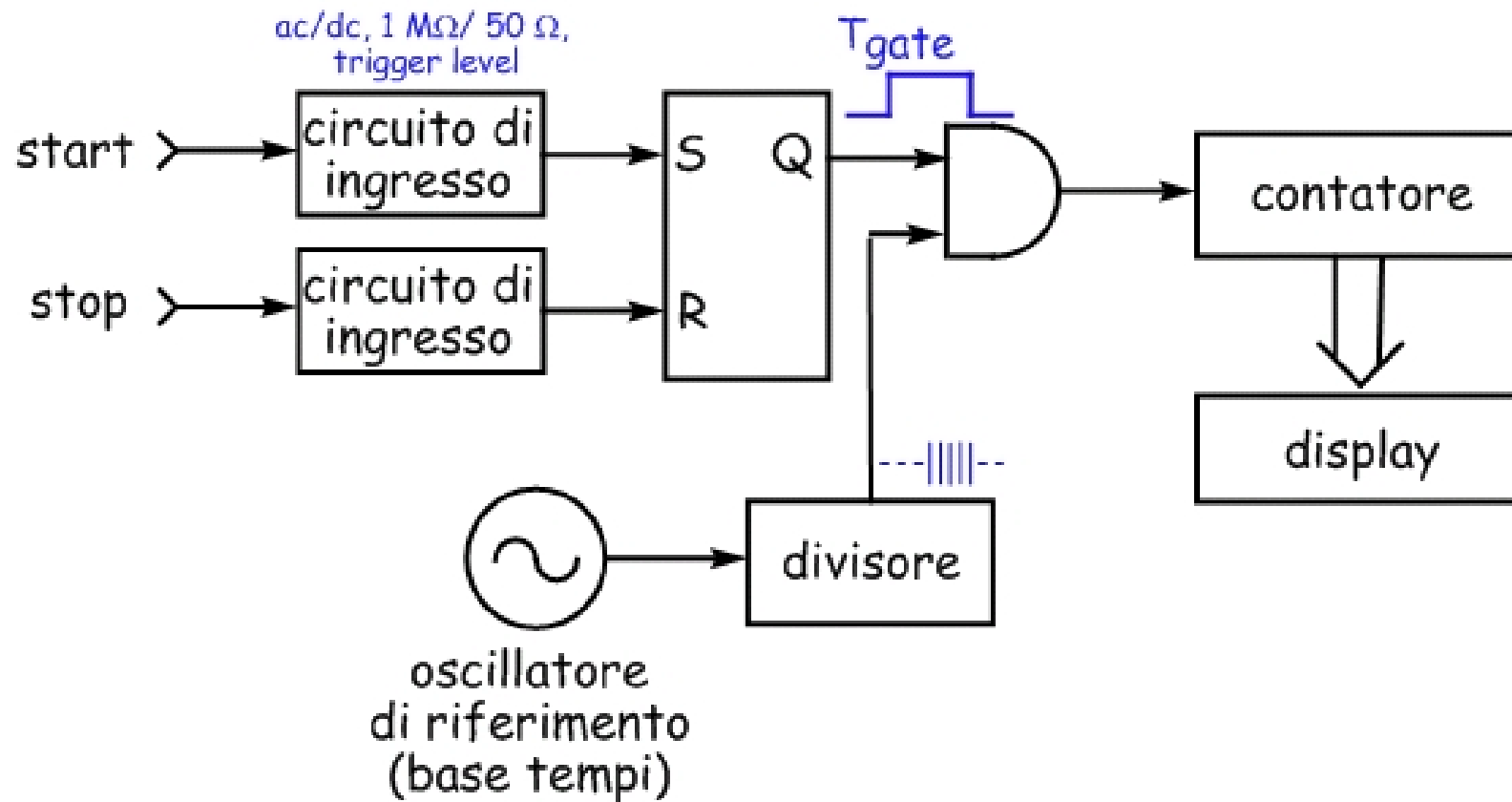
Contatore elettronico



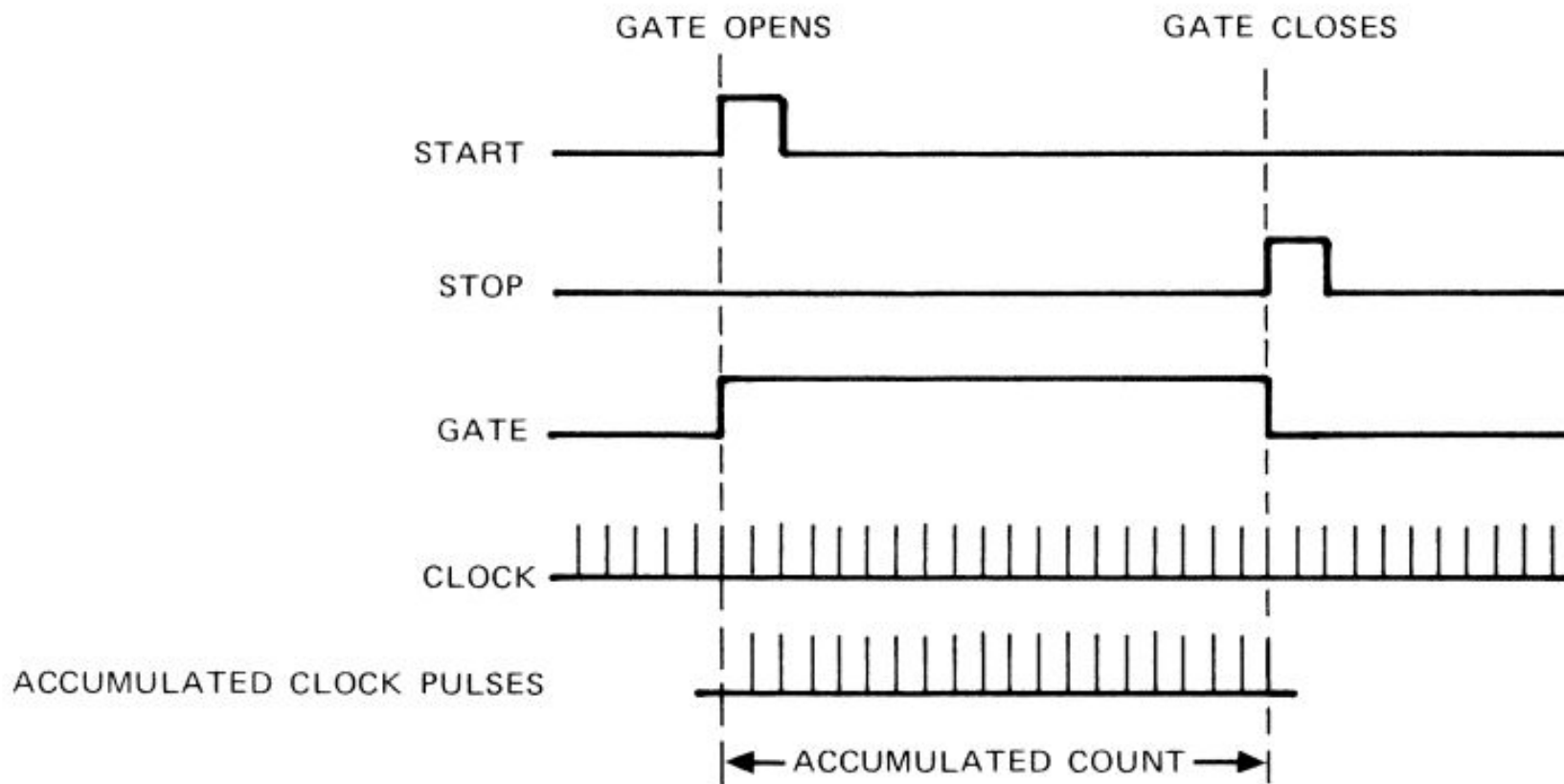
misura di frequenza

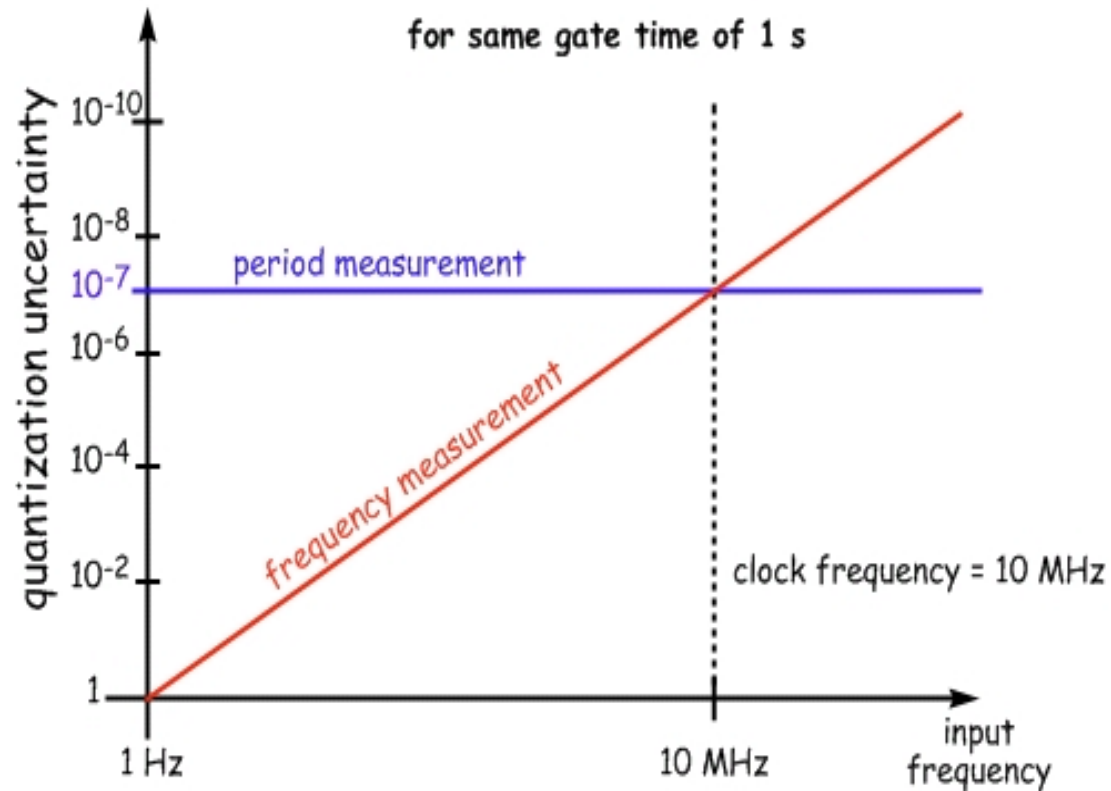
± 1 conteggio (incertezza di quantizzazione)





misura intervallo di tempo





- incertezza nella misura di frequenza: $\Delta f/f = \pm 1 / f_{in}$
- incertezza nella misura di intervallo di tempo: $\Delta t/t = \pm T_{clock} / T_{in}$

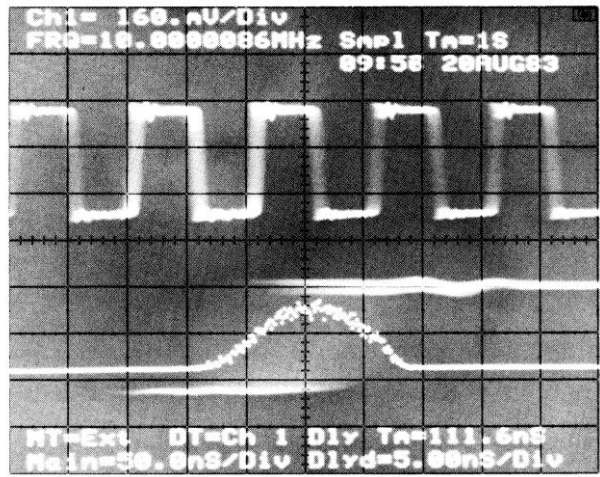
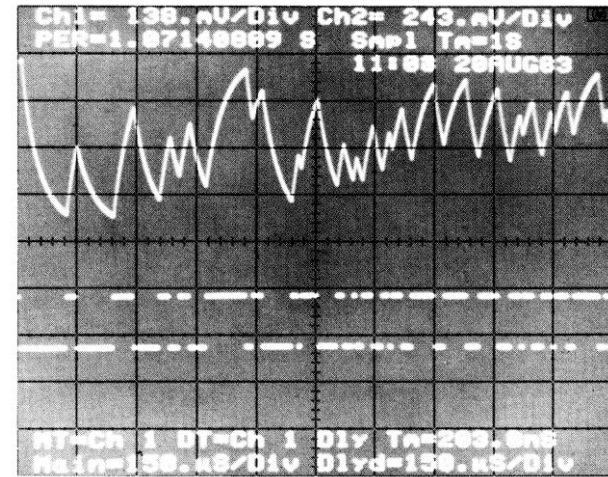
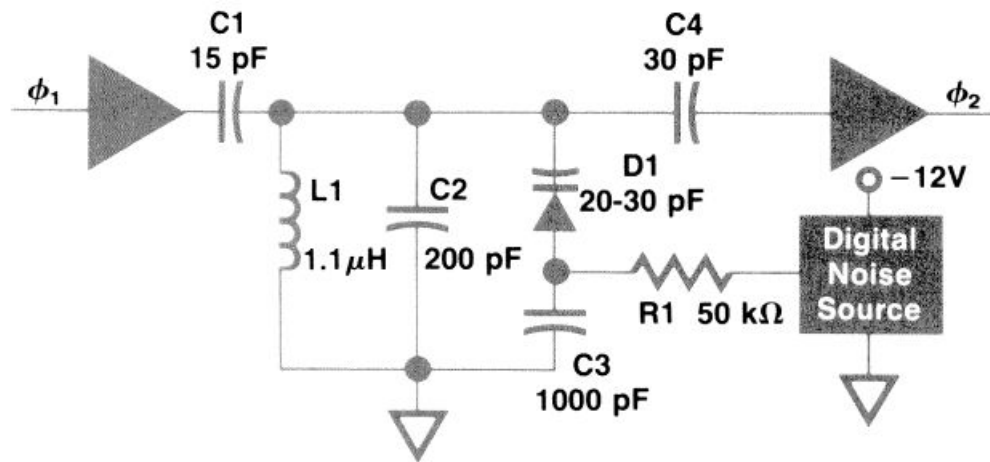
come aumentare la risoluzione

- preferire misure di intervallo di tempo (reciprocal counters);
- aumentare la frequenza di clock (max. 500 MHz, 2 ns);
- media -dithering;
- interpolatore analogico o digitale;
- moltiplicatore di scarto;
- doppio miscelatore.

media - dithering

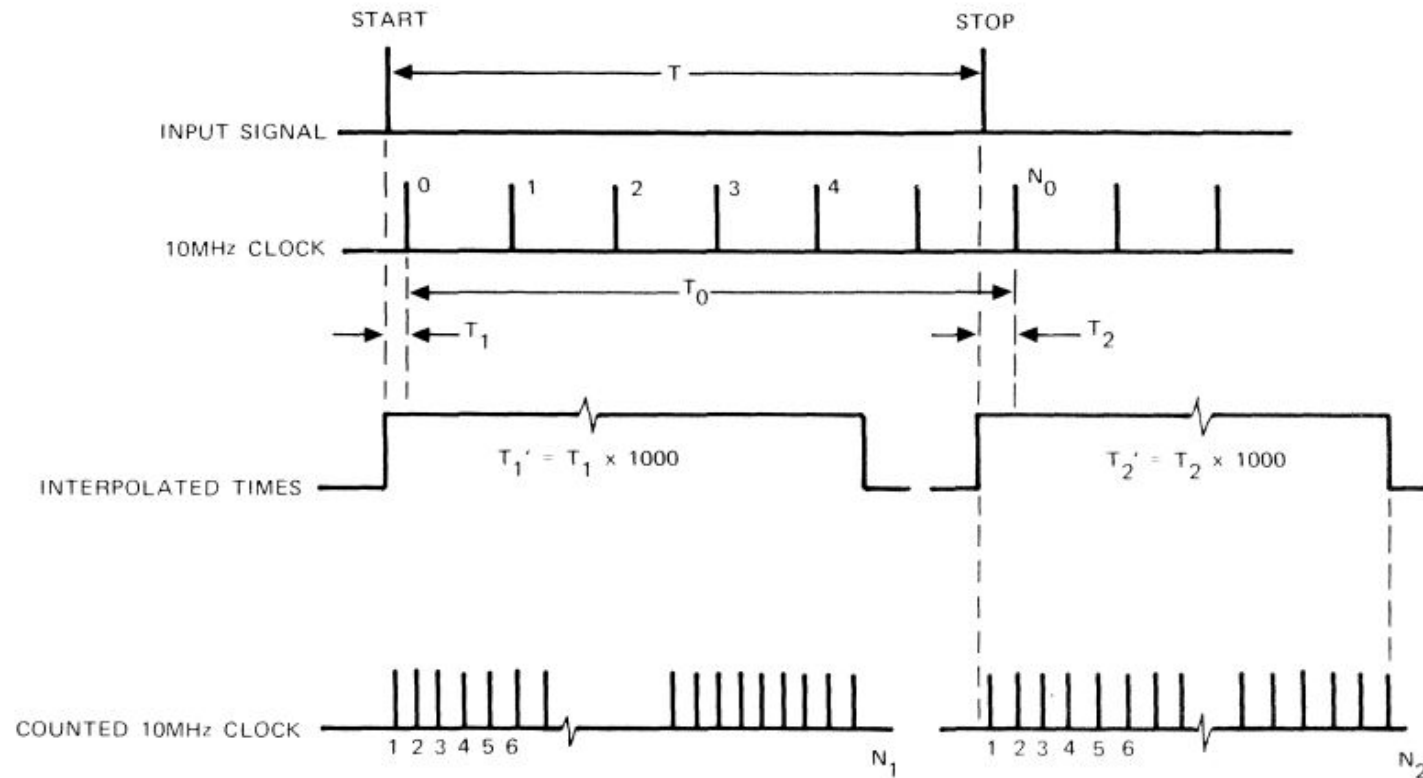
- posso ridurre l'incertezza di misura dovuta all'incertezza di quantizzazione, ripetendo più volte la misura; l'istante di inizio del conteggio deve essere scorrelato rispetto alla sequenza di impulsi in ingresso...
...questo non è generalmente il caso!

Soluzione: modulazione casuale della base tempi



Interpolatore analogico

($f_{\text{clock}} = 10 \text{ MHz}; 100 \text{ ns} \rightarrow 100 \text{ ps}$)

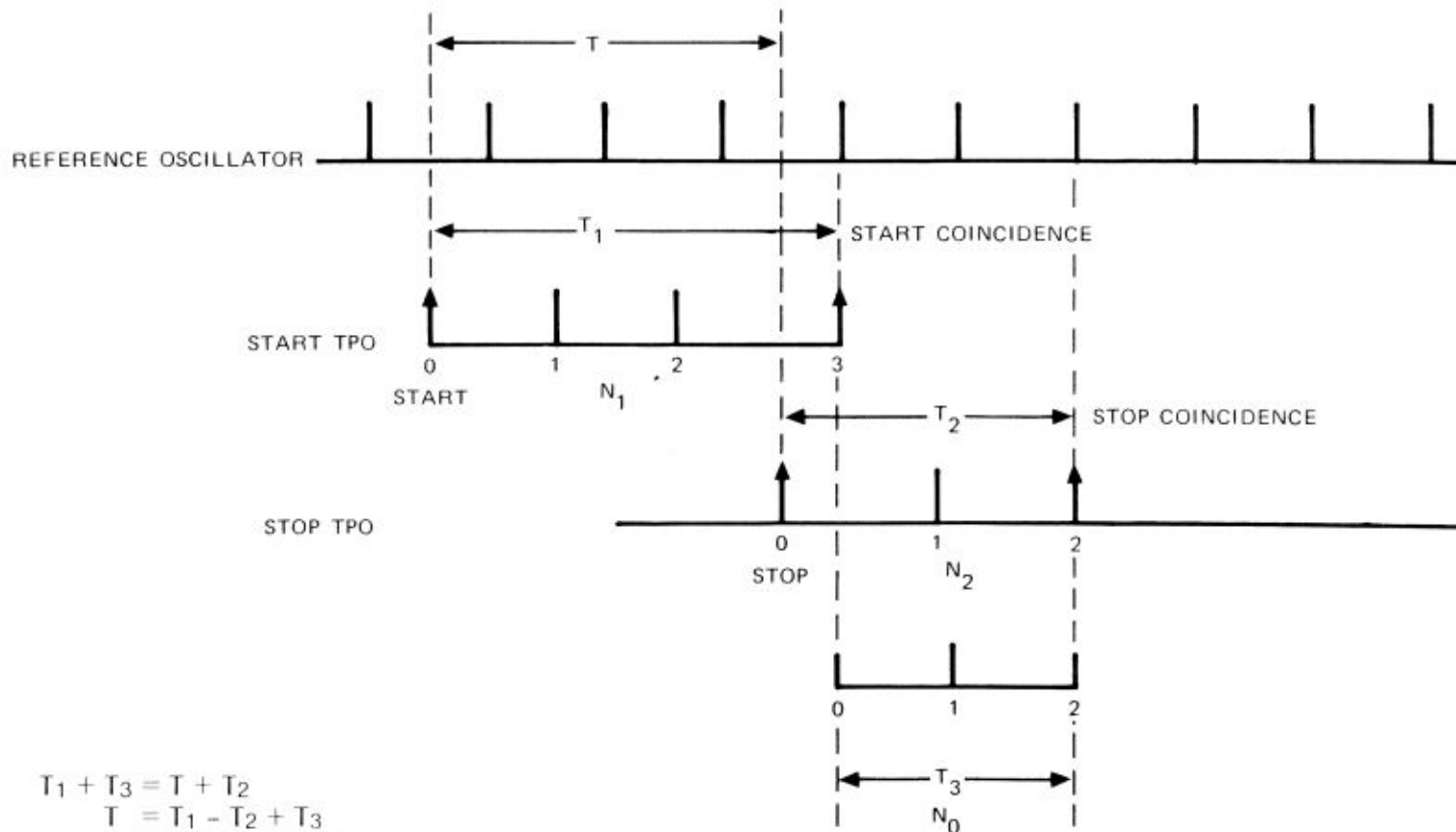


Time Interval $T = T_0 + T_1 - T_2$
 Gated clock pulses,
 Start to stop $= N_0$
 Start interpolation Counts $= N_1$
 Stop interpolation Counts $= N_2$

N_0 proportional to T_0
 N_1 proportional to $T_1' = T_1 \times 1000$
 N_2 proportional to $T_2' = T_2 \times 1000$
 $T = (1000 N_0 + N_1 - N_2) \times 100\text{ps}$

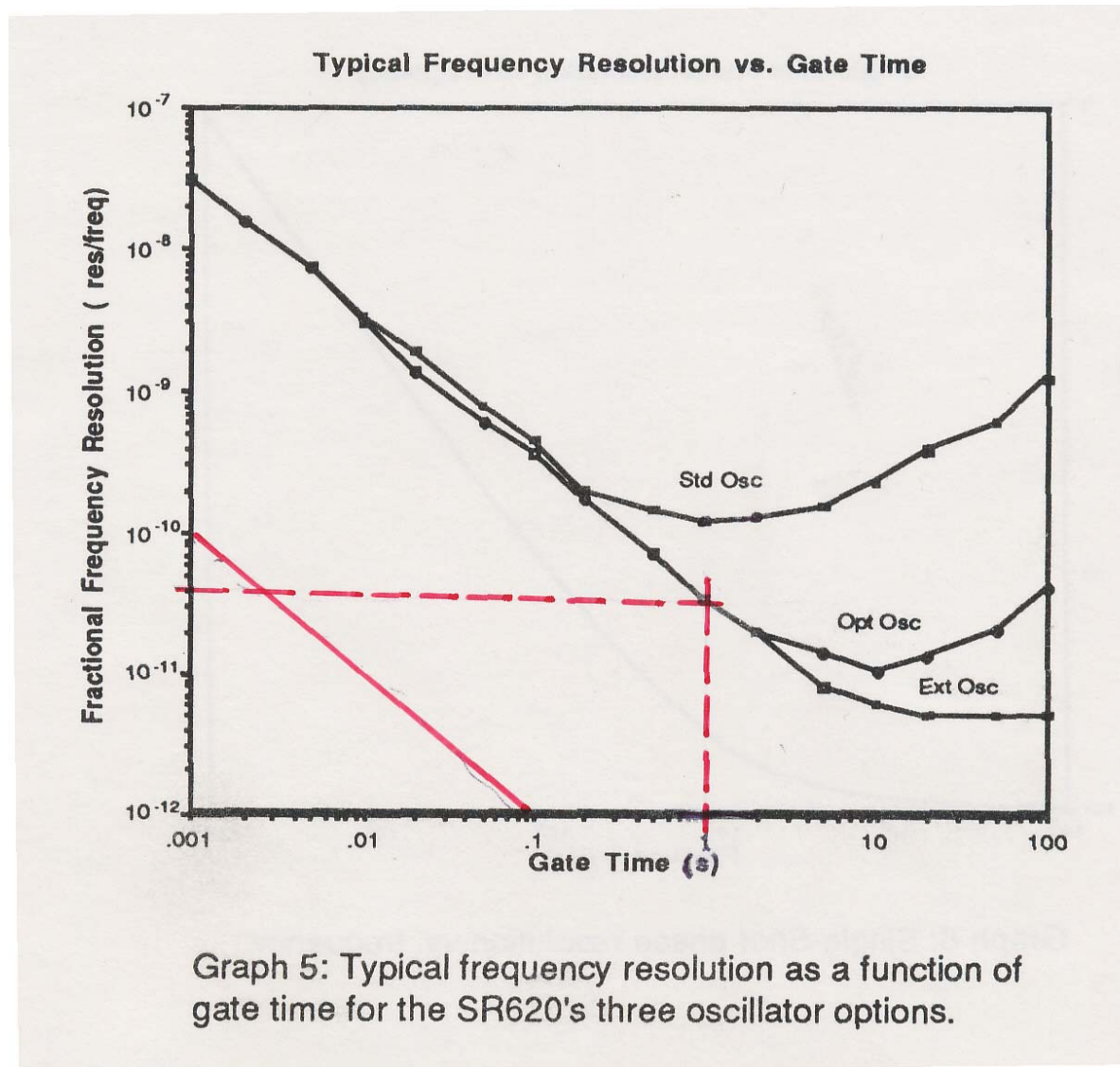
Interpolatore digitale (TPO triggered phase-locked oscillator)

$T_0(1+1/N)$ con $f_0=200$ MHz ($T_0=5$ ns), $N=256 \rightarrow$ ris. 200 ps



$$\begin{aligned}
 T_1 + T_3 &= T + T_2 \\
 T &= T_1 - T_2 + T_3 \\
 T_1 &= N_1 T_0 (1 + 1/N) \\
 T_2 &= N_2 T_0 (1 + 1/N) \\
 T_3 &= N_0 T_0
 \end{aligned}$$

$$\text{Time Interval Measured, } T = T_0 [N_0 + (1 + 1/N) (N_1 - N_2)]$$



Voltmetro integratore

- doppio integratore

V_{in} costante;

SW1 chiuso:

$$V_o(t_u) = -\frac{1}{RC} \int_0^{t_u} V_{in}(t) dt$$

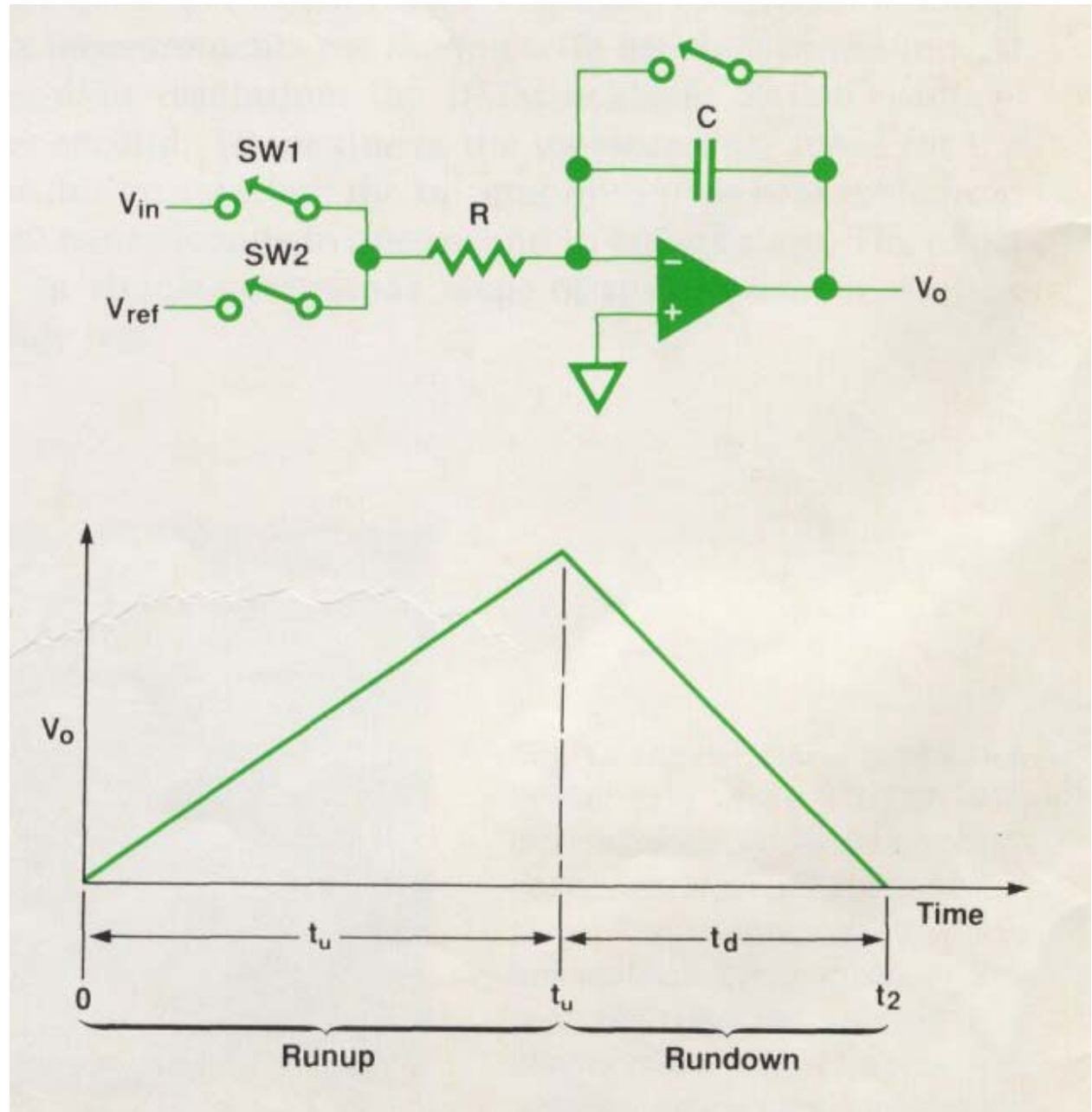
$$V_o(t_u) = -\frac{1}{RC} V_{in} t_u$$

SW2 chiuso:

$$V_o(t_2) = V_o(t_u) - \frac{V_{ref} t_d}{RC} = 0$$

$$t_d = t_2 - t_u$$

$$V_{in} = -V_{ref} (t_d / t_u)$$



se N_u e N_d sono rispettivamente il numero di periodi clock T_{clock} durante la fase di runup e rundown otteniamo:

$$V_{in} = -V_{ref} (N_d / N_u)$$

La forza di questa tecnica sta nella sua insensibilità al valore di diversi parametri del circuito; i valori di R , C e T_{clock} non compaiono nell'espressione finale.

Questa architettura presenta richiede un **compromesso fra risoluzione e velocità...**

...il tempo T_m massimo necessario per la conversione della tensione di ingresso, nel caso in cui questa è pari al fondo scala sarà: $T_m = 2 T_{\text{clock}} M$, dove M è la *risoluzione* (numero di conteggi) fondo scala del convertitore.

esempio: $f_{\text{clock}} = 20 \text{ MHz}$; $M = 10\,000$ conteggi, richiede circa **1 ms** !

La risoluzione di questa tecnica è limitata dalla massima variazione di tensione di uscita dell'integratore e dal rumore a larga banda del circuito; il rumore limita la risoluzione con cui posso determinare l'attraversamento dello zero.

E' difficile determinare l'attraversamento dello zero a meglio di **1 mV**; questo vuol dire che per un fondo scala di **10 V** questa tecnica consente di ottenere **quattro o cinque cifre significative** (A/D a **17 bit**).

enhanced dual-slope

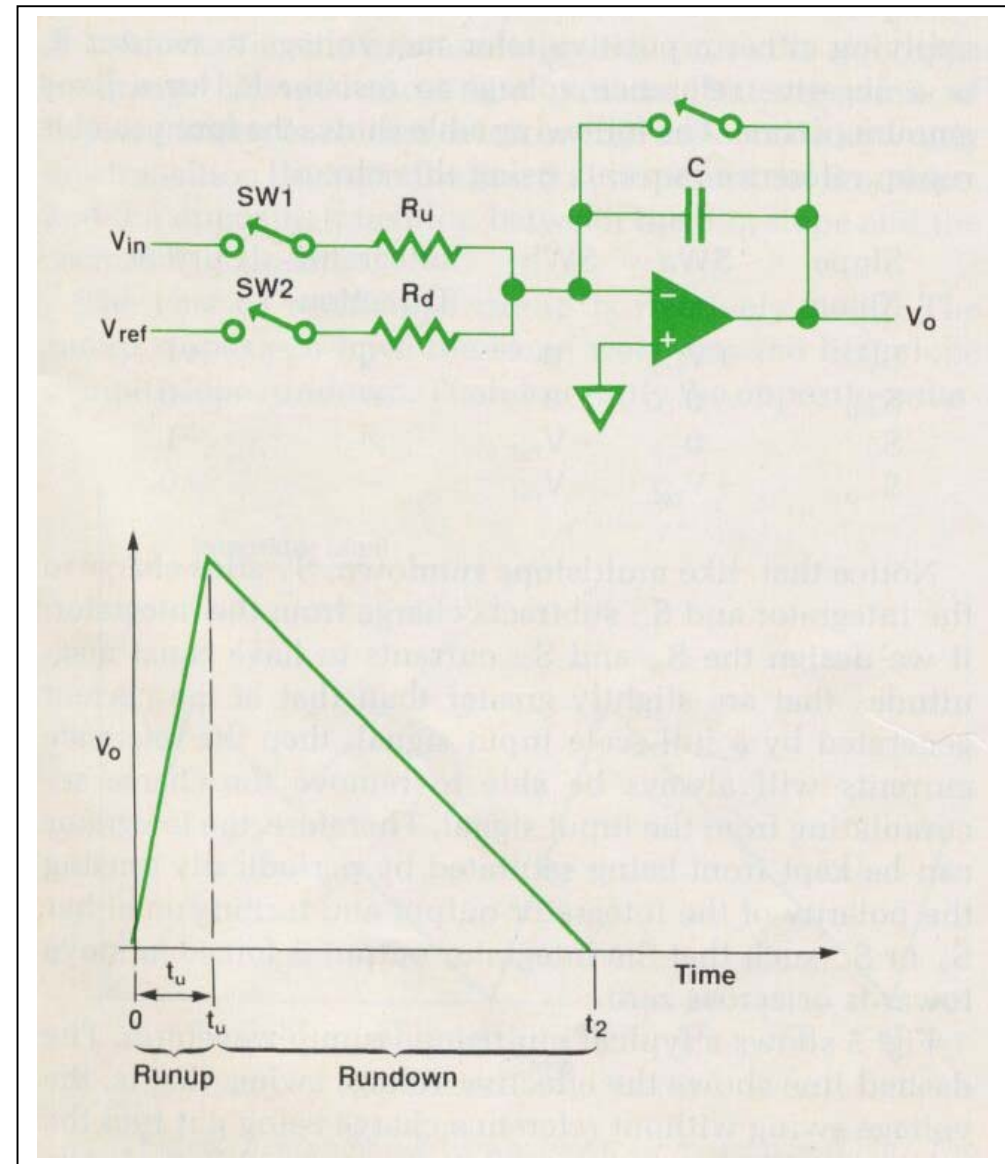
La velocità dell'integratore a doppia-rampa può essere raddoppiata utilizzando una coppia di resistori, uno per la fase di runup e l'altro nella fase di rundown.

$$R_u \ll R_d$$

Questo consente di ridurre il periodo di runup, mantenendo la stessa risoluzione durante la fase di rundown.

$$V_{in} = -V_{ref} \left(\frac{N_d}{N_u} \right) \left(\frac{R_u}{R_d} \right)$$

Il prezzo da pagare è che nell'espressione introduciamo il rapporto R_u/R_d .

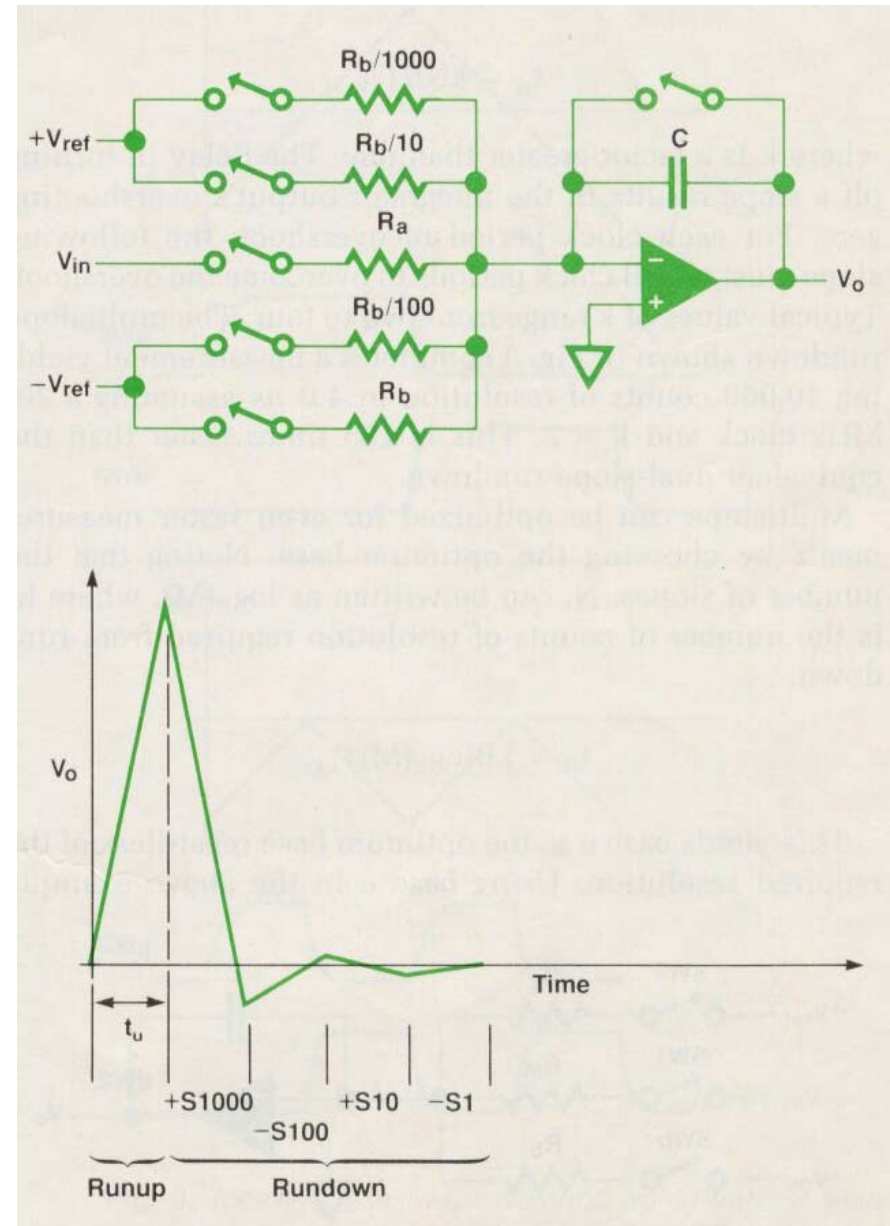


Multislope rundown

Applichiamo ora la stessa tecnica per ridurre la durata della fase di rundown;

Invece di utilizzare un singolo resistore (una sola pendenza per la fase di rundown) per raggiungere lo zero, ne uso diversi (quindi pendenze diverse) e ripeto l'operazione di misura di attraversamento dello zero diverse volte.

Il rapporto fra i diversi resistori è un valore conveniente: 10.



Per ciascuna pendenza l'interruttore è aperto al raggiungimento dello zero entro un periodo di clock T_{clock} .

Ogni operazione di misura determina l'attraversamento dello zero dieci volte più "precisamente" dell'operazione precedente; possiamo visualizzare questo processo come l'aggiunta di una cifra ad ogni passo della misura.

Il tempo necessario a completare il processo di rundown è:

$$t_d < k N B T_{\text{clock}}$$

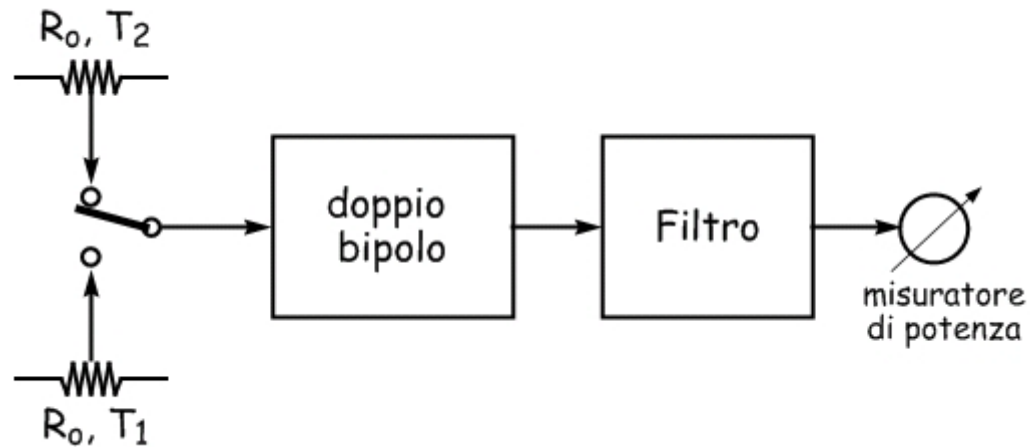
dove N è il numero delle "pendenze";

B è la base (10 nell'esempio);

k è un'opportuna costante ($k > 1$).

esempio - di nuovo per una risoluzione pari a 10 000 conteggi, con una base tempi a 20 MHz ($k = 2$): questa volta sono sufficienti 4 μs .

Misura della cifra di rumore con terminazione calda e fredda (hot cold method, Y)



eseguo due misure di potenze di rumore:

$$P_1 = k(T_e + T_1)B_n g$$

$$P_2 = k(T_e + T_2)B_n g$$

dalle due misure sperimentali P_1 e P_2 ricavo la temperatura equivalente di rumore del d.b.

$$T_e = \frac{T_2 - T_1 \cdot Y}{Y - 1}$$

dove $Y = P_2 / P_1$

Excess Noise Ratio: $ENR = (T_2 / T_1) - 1$

$$F = 1 + \frac{T_2 - T_1 \cdot Y}{(Y - 1) \cdot T_o} = \frac{(Y - 1) \cdot T_o + (ENR + 1 - Y) \cdot T_1}{(Y - 1) \cdot T_o}$$

nel caso in cui $T_1 = T_0$ questa espressione assume la forma

$$F = ENR / (Y - 1)$$

broadband noise source Agilent 346B:

346B: (10 MHz ÷ 18 GHz) ENR ≈ 15 dB ⇒ ENR = 31,6;

$T_1 = T_0$ e $T_2 = 8600$ K !!! (kT₂ = -159.2 dBm/Hz)

Misura della cifra di rumore con analizzatore di spettro

1. ingresso analizzatore chiuso su una terminazione da 50 Ω :
leggo la densità spettrale della potenza di rumore propria dell'analizzatore di spettro: $S_{SA} \approx -146.6$ dBm/Hz
(@ 70 MHz, RF att = 10 dB; RBW = 3 MHz, VBW = 1 kHz);

inserendo il generatore di rumore (acceso o spento) non noto alcuna variazione del rumore di indicato dall'analizzatore.

Posso quindi calcolare la cifra di rumore dell'analizzatore:

$$F = \frac{kT_o g_d + S_d}{kT_o g_d}$$

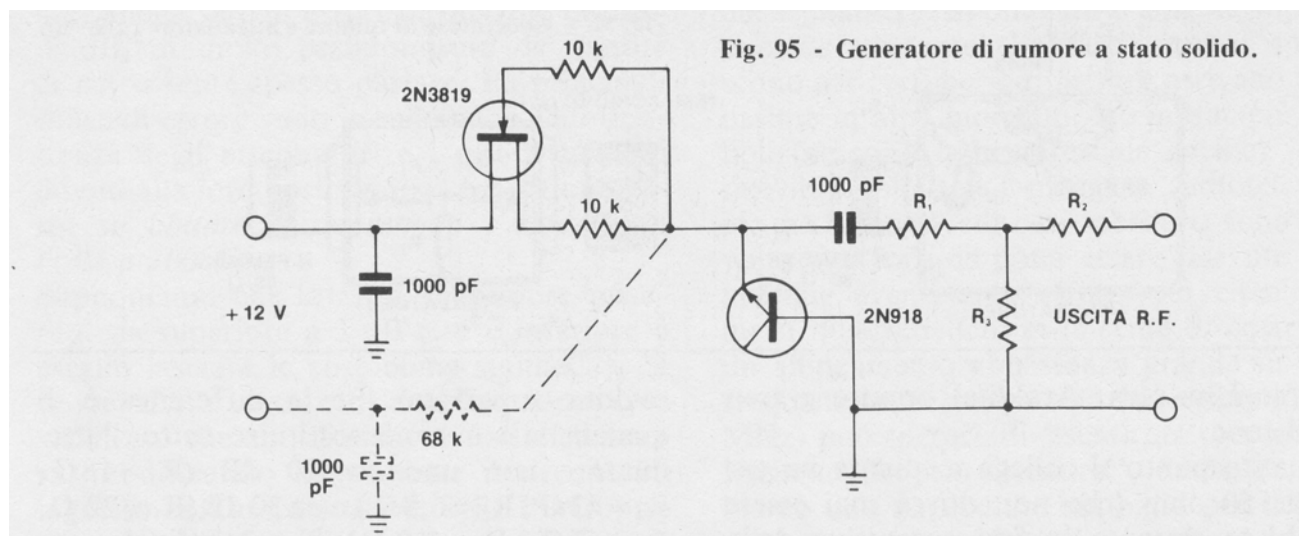
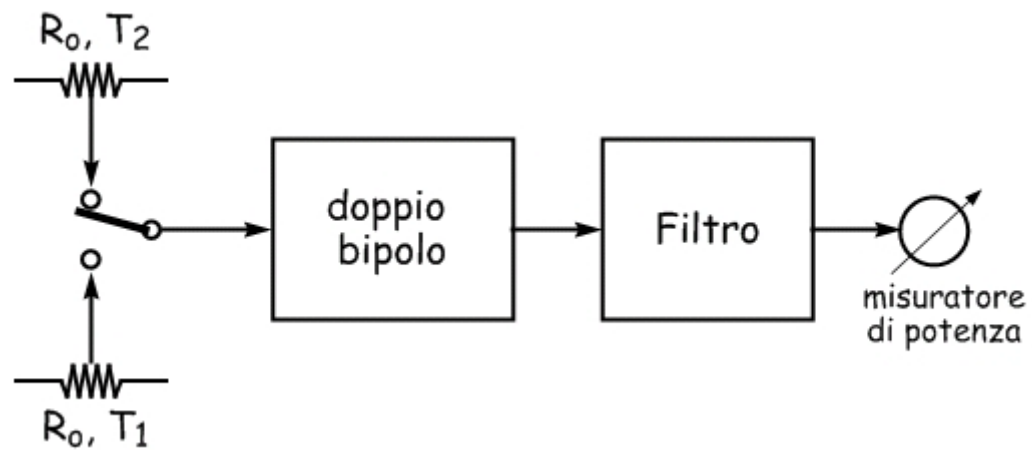
$$F = \frac{kT_o g_d + S_d}{kT_o g_d}$$

$$S_{SA} = (kT_o g_d + S_d) = 45 \text{ fW/Hz} \quad (-146.6 \text{ dBm/Hz})$$

$$\begin{aligned} \text{NF} &= 10 \log_{10} F = 10 \log_{10}(kT_o g_d + S_d) - 10 \log_{10}(kT_o g_d) = \\ &= -146.6 \text{ dBm/Hz} \quad - (-174 \text{ dBm/Hz}) = 27.4 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$F_{SA} = 549.5 \quad (T_{e,SA} = T_o (F-1) = 290 \times 397 \approx 159 \text{ 000 K})$$

N.B. in questo caso le potenze indicate dall'analizzatore di spettro sono riferite all'ingresso dello strumento



2. inserisco fra generatore di rumore e analizzatore di spettro un amplificatore da **52 dB** di cui desidero valutare la cifra di rumore;

- generatore spento: sull'analizzatore leggo **-120.0 dBm/Hz**;
- generatore acceso: questa volta leggo **-103.7 dBm/Hz**

da cui $Y = -103.7 \text{ dBm/Hz} - (-120.0 \text{ dBm/Hz}) = 16.3 \text{ dB}$ (42.7)

per cui la **cifra di rumore globale del sistema** è: $F = ENR / (Y - 1)$

ENR = 22 dB @ 70 MHz (ENR = 158)

$F = 158 / 41.6 = 3.8$ (**5.8 dB**)

3. voglio estrarre a questo punto il contributo di rumore dell'analizzatore di spettro...

$$F_{tot} = F_1 + \frac{F_{SA} - 1}{g_1} = 3.8$$

(il guadagno dell'amplificatore: $g_1 = 52$ dB pari a 158 489)

$$F_1 = F_{tot} - \frac{F_{SA} - 1}{g_1} = 3.8 - \frac{550 - 1}{158489} \approx 3.8$$

l'elevato guadagno dell'amplificatore rende praticamente trascurabile il rumore dell'analizzatore...

....la cifra di rumore dell'amplificatore risulta quindi pari a **5.8 dB**.